

تأثير السمك على الانتقالات الالكترونية لأغشية NiO المحضرة بطريقة

التحلل الكيميائي الحراري

أسعد أحمد كامل سامي سلمان جواد أسامة زيد عبد

تأثير السمك على الانتقالات الالكترونية لأغشية NiO المحضرة بطريقة

التحلل الكيميائي الحراري

أسعد أحمد كامل* سامي سلمان جواد ** أسامة زيد عبد*

*قسم الفيزياء- كلية العلوم- جامعة ديالى

**قسم الفيزياء- كلية التربية- الجامعة المستنصرية

الخلاصة :-

حضرت أغشية رقيقة من أوكسيد النيكل بأسمك مختلفة على قواعد زجاجية باستخدام طريقة التحلل الكيميائي الحراري، حيث تم دراسة تأثير السمك لأوكسيد النيكل على الانتقالات الالكترونية وفجوة الطاقة.

تم حساب الأمتصاصية ضمن مدى الأطوال الموجية nm (300-900) وبأسمك مختلفة nm (140,180,240,280,330)، أذ بينت النتائج بأن الأمتصاصية تقل بزيادة الطول الموجي ولجميع أغشية أوكسيد النيكل بينما تزداد الأمتصاصية بزيادة سمك الغشاء وأن فجوة الطاقة البصرية للأغشية الرقيقة تقل بزيادة السمك.

الكلمات المفتاحية: الاغشية الرقيقة لاوكسيد النيكل، تأثير السمك، طريقة التحلل الكيميائي الحراري، الانتقالات الالكترونية، فجوة الطاقة.

تأثير السمك على الانتقالات الإلكترونية لأغشية NiO المحضرة بطريقة

التحلل الكيميائي الحراري

أسامة زيد عبد

سامي سلمان جواد

أسعد أحمد كامل

Effect of Thickness on the Electronic Transitions of NiO

Thin Films Prepared by Chemical Spray Pyrolysis

Abstract:

Thin films of NiO with different thickness have been prepared by the chemical spray pyrolysis technique. The effect of thickness on the electronic transitions for the prepared NiO thin films and energy gap have been investigated.

The absorbance were calculated in the wavelength range (300-900)nm for different thickness(140 180, 240, 280 ,330) nm, the results show that the absorbance is decrease as the wavelength increased for NiO thin films , while the absorbance increases as the thickness increases .

The optical energy gap of thin films decreased as the thickness increases.

المقدمة :

يمتلك أكسيد النيكل (NiO) التركيب البلوري المشابه لتركيب كلوريد الصوديوم (Na Cl) ، أي من نوع مكعب متمركز الأوجه (Fcc)، ويمتلك توصيلية كهربائية من نوع موجب (p-type) [1].

تعد الخصائص البصرية والكهربائية المتميزة لأغشية أكسيد النيكل (NiO) والتي جعلته يمتلك أهمية كبيرة في كثير من التطبيقات الفيزيائية مثلاً في تطبيقات المواد الضديدة للفيريمغناطيسية وفي شاشات العرض المسطحة (LCD) والمتحسسات وفي صناعة الليزر والمرشحات والطلاءات غير العاكسة وفي صناعة الأصباغ ، وكذلك يمكن استخدام أغشية NiO كأقطاب كهربائية في الأجهزة البصرية الإلكترونية [2].

تعددت طرق تحضير أغشية أكسيد النيكل أذ قسمت الى قسمين :- طرق فيزيائية (كطريقة التبخير الحراري في الفراغ Vacuum Exaporation وطريقة الترسيد Sputtering Method) ، وطرق كيميائية (كطريقة الترسيب الكهربائي Electrical Deposition وطريقة ترسيب بخار العنصر كيميائياً Chemical Vapor Deposition Method والتي تتضمن التحلل الكيميائي الحراري Chemical Spray Pyrolysis) [3].

يهدف البحث الى تحضير أغشية أكسيد النيكل (NiO) بطريقة التحلل الكيميائي الحراري ودراسة تأثير السمك على بعض الخصائص البصرية المتمثلة بالامتصاصية، الانعكاسية، معامل الامتصاص، نوع الانتقال وفجوة الطاقة البصرية .

تأثير السمك على الانتقالات الالكترونية لأغشية NiO المحضرة بطريقة

التحلل الكيميائي الحراري

أسامة زيد عبد سامي سلمان جواد أسعد أحمد كامل

العمل التجريبي :-

تم تحضير أغشية أكسيد النيكل (NiO) وبأسمك منتخبة (140,180,240,280,330) nm من اذابة أسيتات النيكل المائية في 100ml من الماء المقطر وتركيز (001M) ، ولمعرفة وزن أسيتات النيكل المطلوب اذابتها في الماء المقطر تم استخدام العلاقة الآتية :-

$$M = (W_t / M_{wt}) \times [(1000/v)] \text{ -----(1)}$$

ويتم تحريك المحلول بشكل مستمر بواسطة الخلاط المغناطيسي لضمان عملية التجانس الجيد للمحلول لمدة (30 min) ، بعدها يتم ترديد المحلول بواسطة جهاز المرذاذ على القواعد الزجاجية المسخنة بدرجة حرارة (400°C) ، وبفعل عملية التحلل الكيميائي الحراري يتم ترسيب أغشية أكسيد النيكل وحسب المعادلة الآتية :-



أذ كانت الأغشية المحضرة ذات تجانس جيد وشديدة الالتصاق بالقاعدة وخالية من التشققات والثقوب الأبرية ، وأن الظروف الملائمة لتحضير هذه الأغشية تتلخص بما يلي :- (درجة حرارة القاعدة 400°C ، معدل الترسيب 10 /min ، ضغط الهواء 10⁵ pa ، المسافة بين جهاز الترسيب والقاعدة (29±1cm) ، زمن الترديد (7s) ، والزمن بين ترديتين متتاليتين (2min) .

تم تسجيل القياسات البصرية والتي تشمل قياس طيفي الامتصاصية (Absorbance) والنفذية (Transmittance) لمدى الأطوال الموجية (300-900) nm (Visible) - UV - 1650 UV باستخدام المطياف ذي الحزمتين (Recording Spectrophotometer) المجز من قبل شركة (shimadzu) اليابانية ، أذ أجريت جميع القياسات في الظروف الاعتيادية للمختبر.

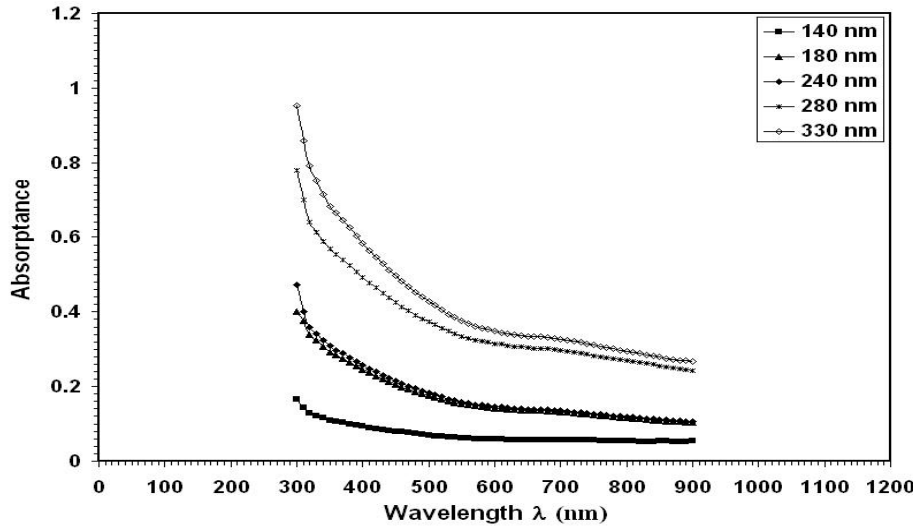
النتائج والمناقشة● الامتصاصية (A)

أجريت قياسات الامتصاصية ضمن مدى الأطوال الموجية (300-900) nm ولجميع الأغشية المحضرة ولأسمك منتخبة، ويتضح من الشكل (1) ان الامتصاصية تقل بصورة تدريجية مع زيادة الطول الموجي ولجميع الأغشية، بينما تزداد الامتصاصية مع زيادة سمك الغشاء، وهذا يدل على ان معامل الامتصاص يزداد مع زيادة السمك.

تأثير السمك على الانتقالات الإلكترونية لأغشية NiO المحضرة بطريقة

التحلل الكيميائي الحراري

أسامة زيد عبد سامي سلمان جواد أسعد أحمد كامل



الشكل (1): الامتصاصية كدالة للطول الموجي لأغشية أكسيد النيكل ولاسماك مختلفة.

● الانعكاسية (R)

تم حساب قيم الانعكاسية لجميع أغشية أكسيد النيكل مختلفة السمك باستخدام المعادلة [4]:

$$R = \frac{(n_o - 1)^2 + k_o^2}{(n_o + 1)^2 + k_o^2} \dots \dots \dots (2)$$

اذ ان:

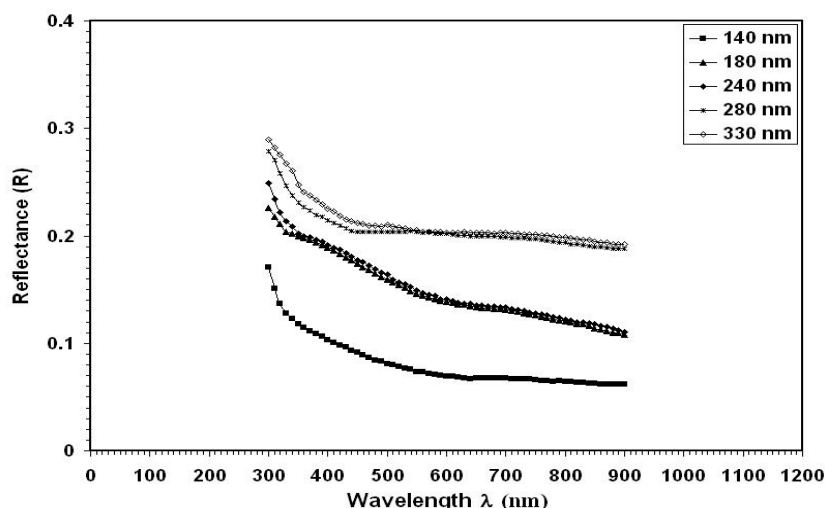
 n_o : معامل الانكسار. k_o : معامل الخمود.

ورسمت علاقة بيانية للانعكاسية كدالة للطول الموجي كما في الشكل (2) ، وقد بينت النتائج ان الانعكاسية تقل بصورة تدريجية تبعاً لزيادة الطول الموجي ولجميع أغشية أكسيد النيكل، بينما تزداد الانعكاسية بصورة تدريجية بزيادة سمك الغشاء ، ان سبب ذلك يعود الى ان زيادة السمك قد اثر في التركيب البلوري لمادة الغشاء وغير في طبيعة سطوح الأغشية.

تأثير السمك على الانتقالات الالكترونية لأغشية NiO المحضرة بطريقة

التحلل الكيميائي الحراري

أسامة زيد عبد سامي سلمان جواد أسعد أحمد كامل



الشكل (2) : الانعكاسية كدالة للطول الموجي لأغشية أكسيد النيكل.

● معامل الامتصاص :

تم حساب قيم معامل الامتصاص لجميع أغشية أكسيد النيكل مختلفة السمك باستخدام العلاقة [5]:

$$\alpha = 2.303 \ A/t \dots\dots\dots(3)$$

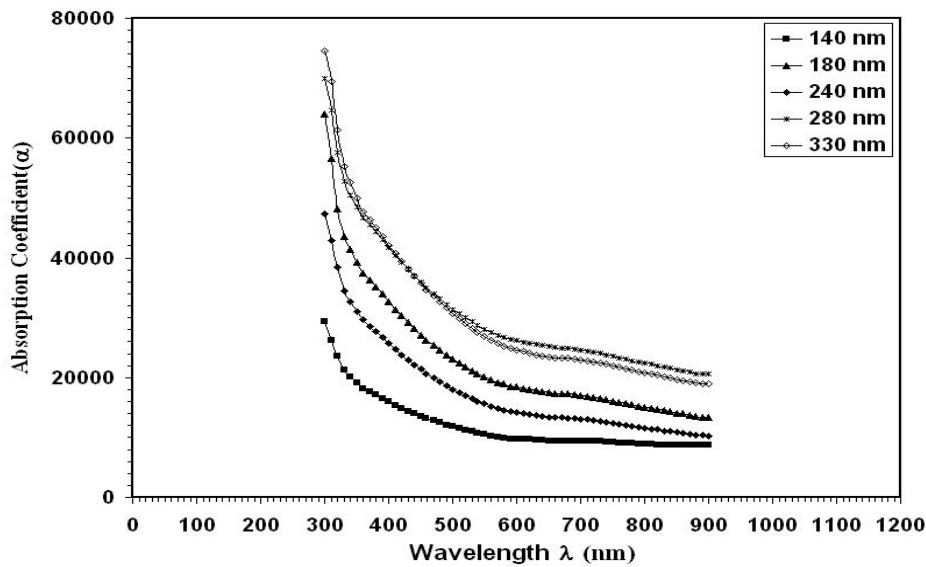
اذ أن: α : معامل الامتصاص، t : سمك الغشاء

ورسمت علاقة بيانية لمعامل الامتصاص كدالة للطول الموجي كما في الشكل (3)، وقد أظهرت النتائج ان معامل الامتصاص يتغير تبعاً لتغير التردد، فهو يعتمد على الطول الموجي اذ ان قيمة معامل الامتصاص تقل بزيادة الطول الموجي ولجميع أغشية أكسيد النيكل بينما تزداد قيمة معامل الامتصاص بزيادة سمك الغشاء، ولوحظ ان قيم معامل الامتصاص اكبر من (10^4 cm^{-1}) عند الأطوال الموجية القليلة (طاقة الفوتون عالية) مما يرجح حدوث الانتقالات الالكترونية المباشرة.

تأثير السمك على الانتقالات الالكترونية لأغشية NiO المحضرة بطريقة

التحلل الكيميائي الحراري

أسعد أحمد كامل سامي سلمان جواد أسامة زيد عبد



الشكل (3): معامل الامتصاص كدالة للطول الموجي لأغشية أوكسيد النيكل

● حساب قيم فجوة الطاقة للانتقال المباشر المسموح (E_g)

حُسبت قيمة فجوة الطاقة البصرية للانتقال الالكتروني المباشر المسموح ولجميع الاغشية المحضرة باستخدام المعادلة [6]:

$$\alpha h\nu = P(h\nu - E_g)^r \quad \dots\dots\dots (4)$$

حيث إن: P : ثابت، E_g : فجوة الطاقة البصرية، r : معامل أسّي يعتمد على نوع الانتقال، h : ثابت بلانك، α : التردد

وعندما تكون قيمة الثابت ($r=1/2$) تصبح المعادلة (1) بالشكل الآتي :

$$\alpha h\nu = P(h\nu - E_g)^{1/2} \quad \dots\dots\dots (5)$$

نحصل على: وبترتيب الطرفين

$$(\alpha h\nu)^2 = (\alpha E)^2 = P^2 (h\nu - E_g) \quad \dots\dots\dots (6)$$

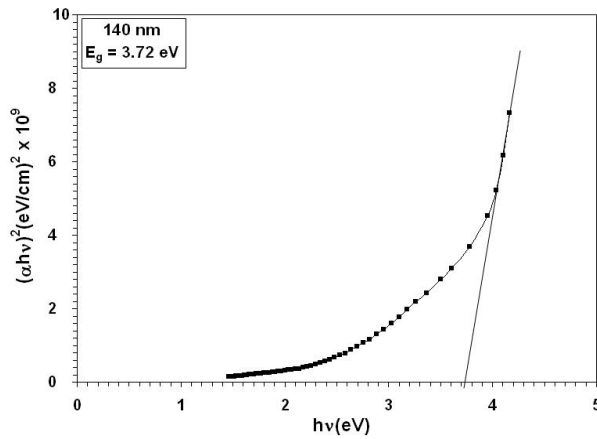
ومن خلال رسم الطرف الايسر من العلاقة (6) مع طاقة الفوتون نحصل على قيمة فجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح لأغشية أوكسيد النيكل والتي كانت بحدود (3.72 eV) للغشاء ذي السمك (140 nm) وهي تقل مع زيادة

تأثير السمك على الانتقالات الالكترونية لأغشية NiO المحضرة بطريقة

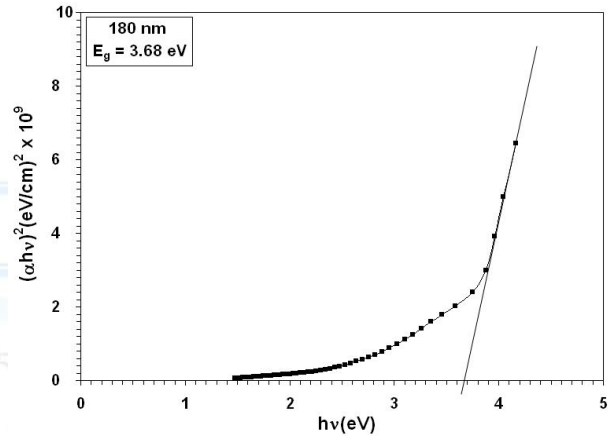
التحلل الكيميائي الحراري

أسعد أحمد كامل سامي سلمان جواد أسامة زيد عبد

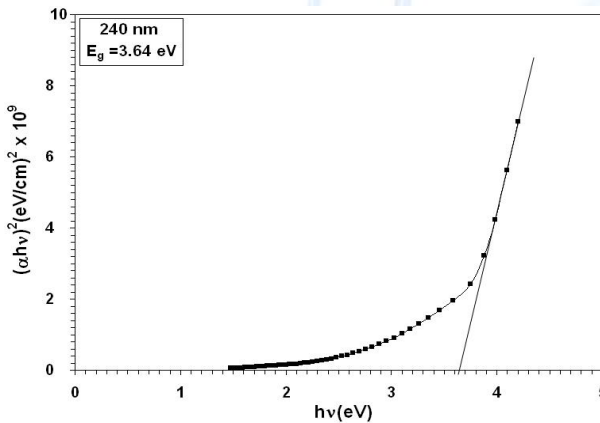
سمك الغشاء المحضر، وكما موضح بالشكل (a,b,c,d,e)، وان سبب نقصان قيمة فجوة الطاقة البصرية لأغشية اوكسيد النيكل يعود الى ان معدل الحجم الحبيبي يتناقص بزيادة السمك مما يدل على نقصان تبلور الأغشية وبالتالي نقصان تركيز الحاملات وبذلك تقل فجوة الطاقة البصرية [7].



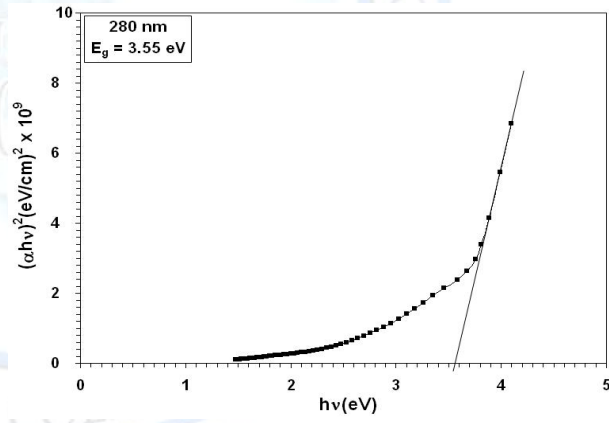
(a) NiO (t=140 nm)



(b) NiO (t=180 nm)



(c) NiO (t=240 nm)

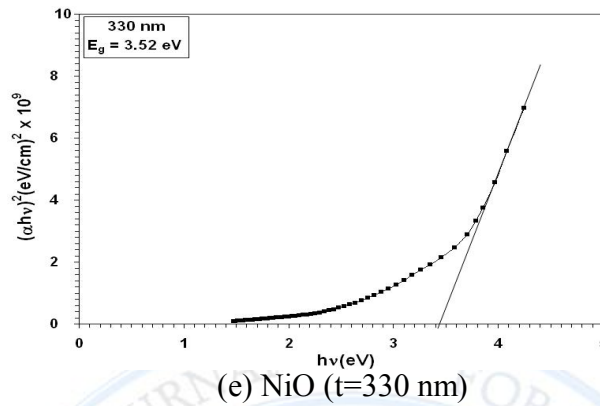


(d) NiO (t=280 nm)

تأثير السمك على الانتقالات الالكترونية لأغشية NiO المحضرة بطريقة

التحلل الكيميائي الحراري

أسعد أحمد كامل سامي سلمان جواد أسامة زيد عبد



الشكل(4): قيم فجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح لأغشية اوكسيد النikel ولاسماك مختلفة.

• حساب قيم طاقة ذبول اوريباخ (ΔE_U)

تم حساب طاقة ذبول اوريباخ والتي تمثل عرض الحالات الموضعية المسموحة داخل فجوة الطاقة البصرية من المعادلة [8]:

$$\alpha = D \exp(h\nu / \Delta E_U) \dots\dots\dots (7)$$

حيث ان :

D: ثابت.

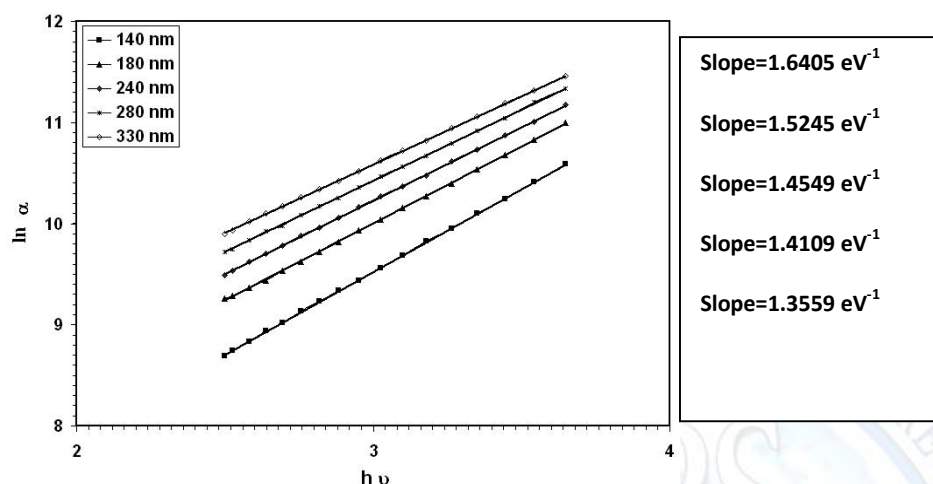
ΔE_U : طاقة ذبول اوريباخ.

ويمثل مقلوب قيمة ميل الخط المستقيم للعلاقة المرسومة بين $(\ln \alpha)$ و $(h\nu)$ وكما في الشكل(3)، حيث وجد ان قيمة طاقة ذبول اوريباخ تزداد بزيادة السمك بخلاف قيم فجوة الطاقة البصرية، ان زيادة طاقة ذبول اوريباخ يدل على عرض المستويات الموضعية قد ازداد بزيادة السمك وتتفق هذه النتائج مع نتائج حيود الأشعة السينية في حساب معدل الحجم الحبيبي .

تأثير السمك على الانتقالات الالكترونية لأغشية NiO المحضرة بطريقة

التحلل الكيميائي الحراري

أسعد أحمد كامل سامي سلمان جواد أسامة زيد عبد



الشكل (5): لو غارتم معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون الساقط لأغشية اوكسيد النيكل ولا سماك مختلفة.

والجدول (1) يبين قيم فجوة الطاقة البصرية للانتقال المباشر المسموح وقيم طاقة ذبول اورباخ لجميع الأغشية المحضرة.

جدول (1): قيم فجوة الطاقة وطاقة ذبول اورباخ لجميع الأغشية المحضرة.

طاقة ذبول اورباخ	الانتقال المباشر المسموح	سمك غشاء (NiO)
ΔE_U (eV)	E_g (eV)	t (nm)
0.60	3.72	140
0.65	3.68	180
0.68	3.64	240
0.70	3.55	280
0.73	3.52	330

تأثير السمك على الانتقالات الإلكترونية لأغشية NiO المحضرة بطريقة

التحلل الكيميائي الحراري

أسعد أحمد كامل سامي سلمان جيد أسامة زيد عبد

الاستنتاجات :-

- 1- تبين ان زيادة معامل الامتصاص هي زيادة تدريجية بطيئة عند الطاقات الواطئة لذلك يمكن أن تستخدم أغشية أوكسيد النيكل كطلاءات مضادة للانعكاس ضمن الطاقات الواطئة.
- 2- الانتقالات الإلكترونية الناشئة عن عمليات الامتصاص الأساسية هي انتقالات من النوع المباشر المسموح ، وهذا يدل على أن الأغشية المحضرة ذات فجوة طاقة مباشرة.
- 3- نستنتج من خلال نتائج حساب الانتقالات الإلكترونية بأن المادة بزيادة السمك أصبحت أكثر تبلورا.



تأثير السمك على الانتقالات الالكترونية لأغشية NiO المحضرة بطريقة

التحلل الكيميائي الحراري

أسعد أحمد كامل سامي سلمان جواد أسامة زيد عبد

المصادر:-

- 1- F. saadati ,A. R. Grayli and H. savaloni, "Dependence of the optical properties of NiO thin films thickness and nano- structure", p. 22-26 (2010).
- 2 – A. M. Bakry and S-A Mahmoud., "Effect of substrate Temperatur on the optical dispersion of sprayed nickel oxide thin films", (2010).
- 3- K. L. chopra, "Thin film phenomena" , Mc0 Graw- Hill, New York , (1985).
- 4-J.I pankove , "Optical processes in semiconductors" , prentice – Hall , N . J , (1971) .
- 5- Willian C. Dickinson, paul N. Cheremisionoff, solar Energy Techology ", Handbook part A, (1980) 498 .
- 6- J. Tauc, "amorphous and liquid semiconductors", plenum press, London, N .Y., (1974).
- 7-F. Nagles, "Electronic Transport In Amorphous semiconductors", (1979).
- 8- N. F. Mott and E. A. Davis., "Electronic processes in non- crystalline materials", 2nd Ed ,clarendon press , (1979).